

## DP WGの活動報告(第39回研究会)

参加者：荒木(日産アーク)、山内(矢崎総業)、有明(秋田産技C)、荒井(住金)  
一條(マクセル)、梯(三菱マテリアル)、奥村(三菱マテリアル)、酒井(トキヤマ)  
荻原(NIMS)、堤(JEOL)、永富(阪大)、高橋(島津)佐藤(富士通クリティカル)  
斎藤(サークル)、佐藤(帝人)、石津(パナソニック)

### 今回の議論内容

共通レシピに従ってイオンガンを調整した結果に関して

- ・現状の調整法と巧みの調整法によるイオンビームの形状の変化
- ・スパッタ率、深さ分解能の差
- ・何を目安に調整をすれば良いのか？

共通レシピの改善

### 今回の結論

- ・レシピがJEOL用になっており、PHIの装置ではイオンのイメージが見にくいで  
フーラデーカップであわせた後、スポットでのスパッタ痕を見ながら調整するのが良い。
- ・巧みの調整により、形状は丸に近く整ってきてる
- ・深さ分解能が向上している



スパッタ痕の形状と深さ分解能を目安に調整をするのが良さそう

- ・共通レシピの完成度を上げよう

追加：界面の測定点数が5～7点必要